



AES

深度剖析。

分析固体材料表面纳米深度的元素（部分化学态）组成，可以对纳米级形貌适合分析无机材料，元素组成及化学态分析（如：颗粒，片材等）均匀表面组成，又可以分析材料特定微区结构或特定产品表面缺陷如污染，腐蚀，掺杂，氧化，还原，吸附、晶界杂质偏析等，还具备深度剖析功能表征钝化层，掺杂深度，纳米级多层膜层结构等。

成分检出限：0.1atom%

3.检测限：太瓦级元素 1 ppm 部分化学态

1.空间分辨率：8nm

2.采集深度：0.5-7.5nm

GD-MS

进行高纯材料（金属，合金，石墨，电子材料，氧化物和陶瓷等）的全元素含量测试。

1.一次性提供从 Li-U (C, N, O, H 除外) 的所有元素含量

2.检测限：ppb~ppm 级

